

レーザーマイクロ形3Z4L (旧タイプ) 生産中止のお知らせ

レーザーマイクロ形3Z4L (旧タイプ) の生産を中止します。

生産中止機種と代替機種

生産中止機種	代替推奨機種
形3Z4L-H202M (G)	→ 形3Z4L-H1202M
形3Z4L- 305M (G)	→ 形3Z4L- 1305M
形3Z4L- 610M (G)	→ 形3Z4L- 1610M
形3Z4L-D305M (G)	→ 形3Z4L-D7305M
形3Z4L-D610M (G)	→ 形3Z4L-D7610M

詳細については2ページ以降をご覧ください

旧製品の製造の可否

不可能です。

実施時期

- 昭和63年2月29日をもって生産中止しています。

レーザーマイクロ形3Z4L 新・旧 対照表

レーザーマイクロ形3Z4Lシリーズ（旧タイプ）の生産中止に伴ない、新タイプとの外観形状、機能、動作の各部に変更を発生したので、新・旧の変更部をリストアップします。

1. 形 式

区 分	旧	新
セ ッ ト 形 式	形3Z4L-H202M (G) 形3Z4L- 305M (G) 形3Z4L- 610M (G) 形3Z4L-D305M (G) 形3Z4L-D610M (G)	形3Z4L-H1202M 形3Z4L- 1305M 形3Z4L- 1610M 形3Z4L-D7305M 形3Z4L-D7610M
コントローラ部形式	無 し	形3Z4L-C1(標準) 形3Z4L-C2(小形)
セ ン サ 部 形 式	無 し	形3Z4L-H202(高精度用) 形3Z4L- 305(He-Ne 30mm) 形3Z4L- 610(He-Ne 60mm) 形3Z4L-D305(LD 30mm) 形3Z4L-D610(LD 60mm)

(G) は透明体タイプ、新型では、普通タイプに包含しています。

2. 外観形状

項 目	旧	新
標準（プリンタ付）寸法	432W×158H×408D	432W×159H×376D
小形（プリンタ無）寸法	340W×130H×355D	同 左
表示用語	付図1-1, 付図2-1 △ C1, C2	付図1-2, 付図2-2 R HC, LC
キーボード	付図3-1, 付図4-1 [SEG], [AVG]	付図3-2, 付図4-2
廃 止		
増 設		[(C.RUN)], [(S.PR)] [(SHIFT)], [(L.CAL)] [O F S], [(TCAL)] [(+ / -)], [S.D] [(C.E)], [(A.CL)]
変 更	[CAL], [△]	[H.CAL], [R]

3. 機能変更

項 目	旧	新
He-Ne ↔ LD モークスピード 最小読取値 M ↔ MG H202	ROM交換 回路変更, ROM交換 ROM交換 基板変更, アクリルボード, ROM交換 専用受光基板, 回路変更, ROM交換	DIP SW設定 HIGH-CAL SW設定 DIP SW設定 DIP SW設定 DIP SW設定(共通受光基板, 専用受光 基板いずれも可)
セグメント数	1~5任意組み合わせ	1~6組合せ一部制限有
多段選別	ROM交換, Prog 0のみ多段 他合否判定	DIP SW設定, 同時測定 Prog 0~4 合否 Prog 5~9 多段
同時測定 Prog 0~9 多段選別	不可 不可	上記 DIP SW設定, ROM交換
X-Y測定 極細線測定 TCAL適用 定時間毎プリント 統計(STAT)判定 統計(STAT)標準偏差表示 統計(STAT)直前データ取消	不可 不可 Prog, 0のみ 不可 不可 不可 不可	DIP SW設定 DIP SW設定 Prog 0~9 全てに適用 DIP SW設定 DIP SW設定 増設 増設
ウインド汚損チェック 測定インターバル変更	不可 不可	電源ON時実施(7-7有時無効) DIP SW設定(単倍2段)

4. 動作変更

項 目	旧	新
合否判定	$(L) \leq GO$ 判定 $\leq (H)$	$(L) \leq GO$ 判定 $< (H)$
RUN後結果ホールド	実施	(Display, DCD)5秒後ホールド解除 (判定, アナログ出力)はホールド
SEG変更時のOFFSET	解除	新たなSEGには適用しないがSEG回 復時再適用
CAL時のOFFSET, T-CAL	従前のまま	解除
W-position-LED	スキャン波形をそのまま表示	CPU制御のためスキャン波形と異なる 場合も有り
設定値0.0及びマイナス値	不可	可
表示桁数 BCD出力桁	610M(G)のみ6桁, 他は7桁 最小桁 0.1 μ m固定	全て7桁に統一(右詰め) 最小桁は最小読取値桁